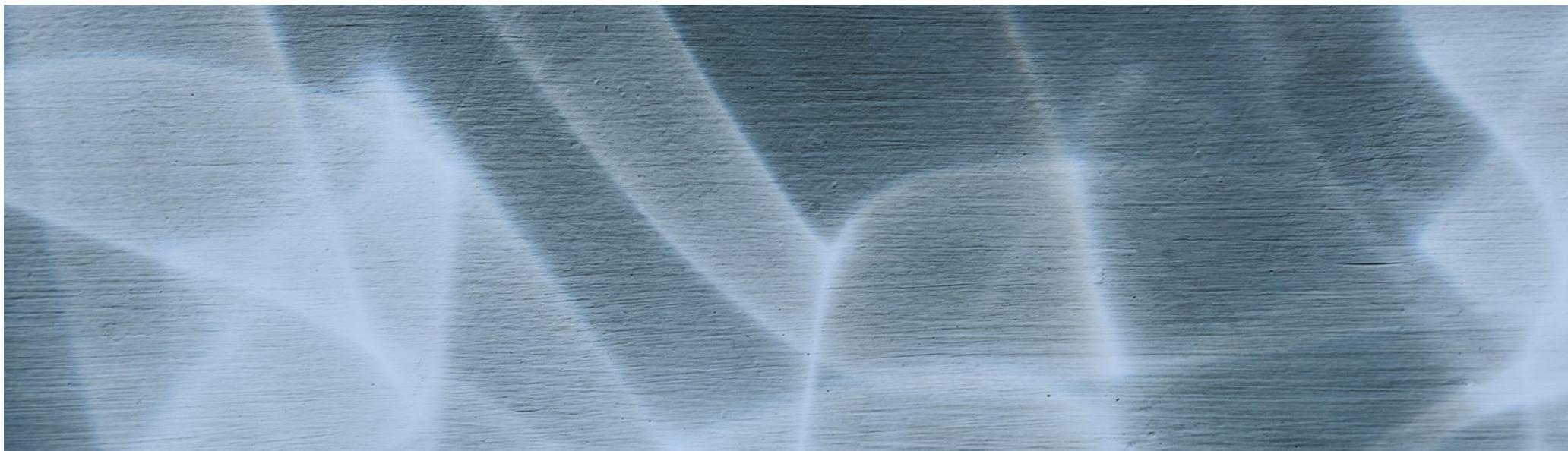




Otsuka

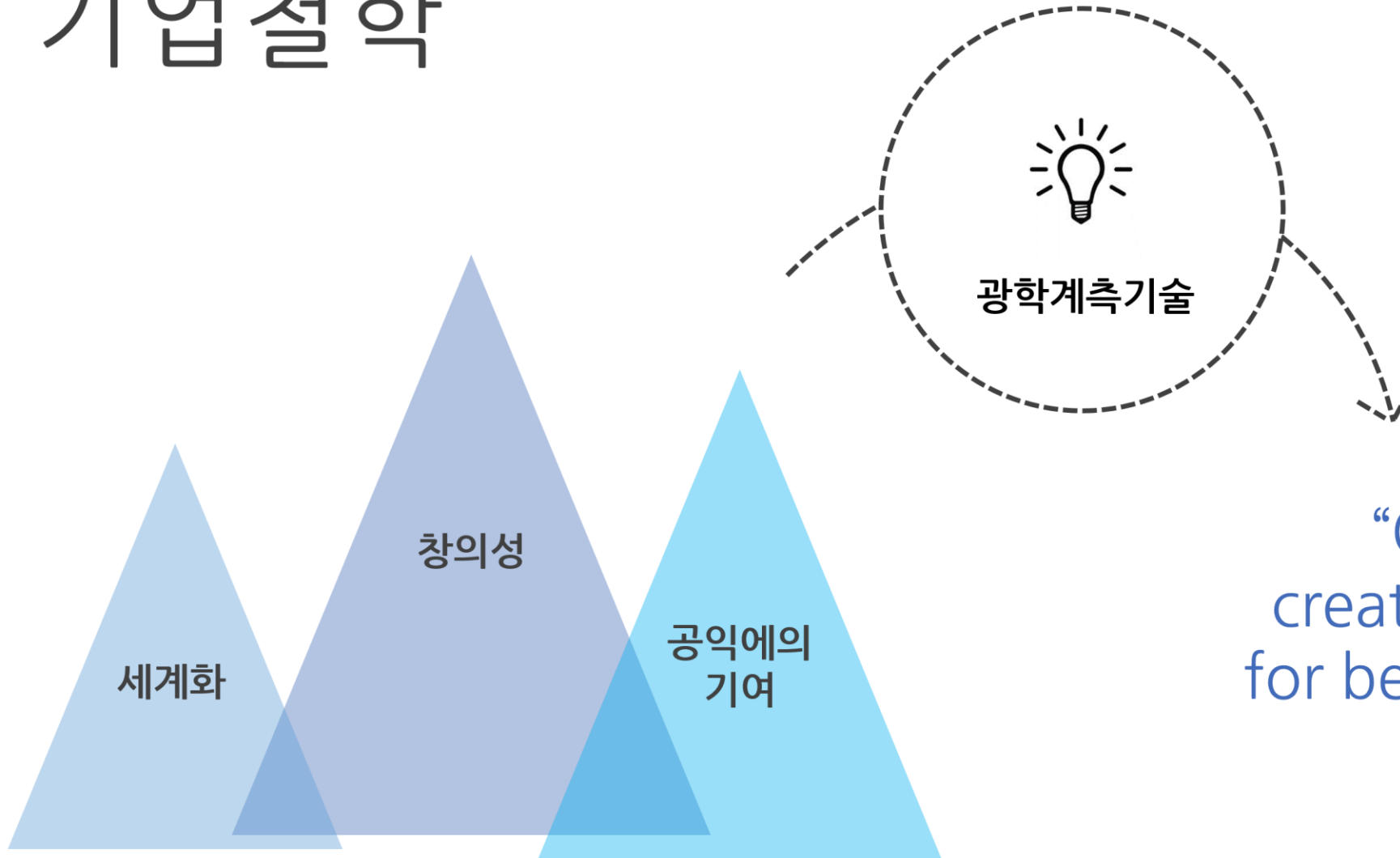
Otsuka Electronics Korea Co., Ltd.

한국오츠크전자 회 사 소 개 서



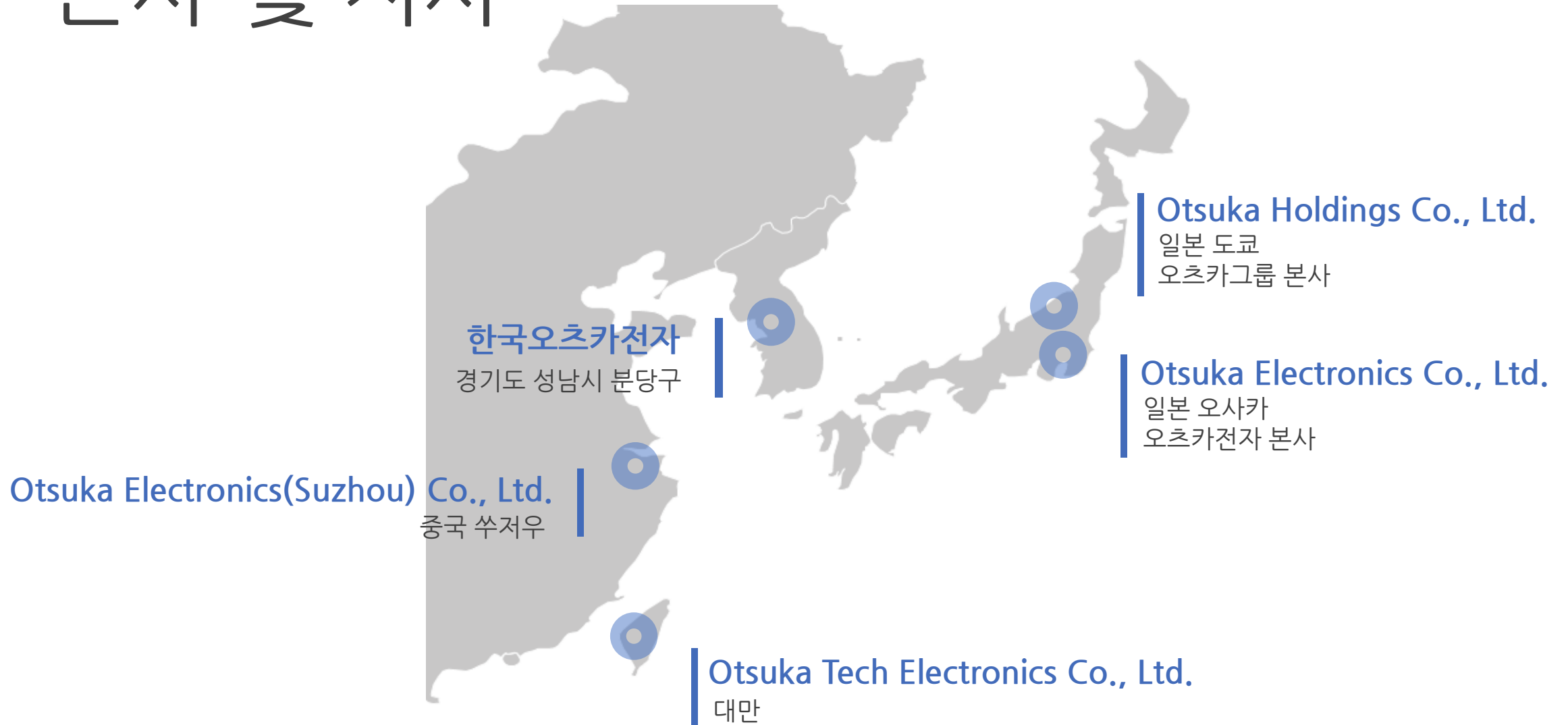
회 사 소 개

기업철학



“Otsuka-people
creating new products
for better health and life
worldwide.”

본사 및 지사



회사개요



대표이사

유정현



설립일

2003년 8월 8일



주소

경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41
파인벤처빌딩 6층 B호 (13496)



직원 수

42 명



매출액

120억 원(2018)



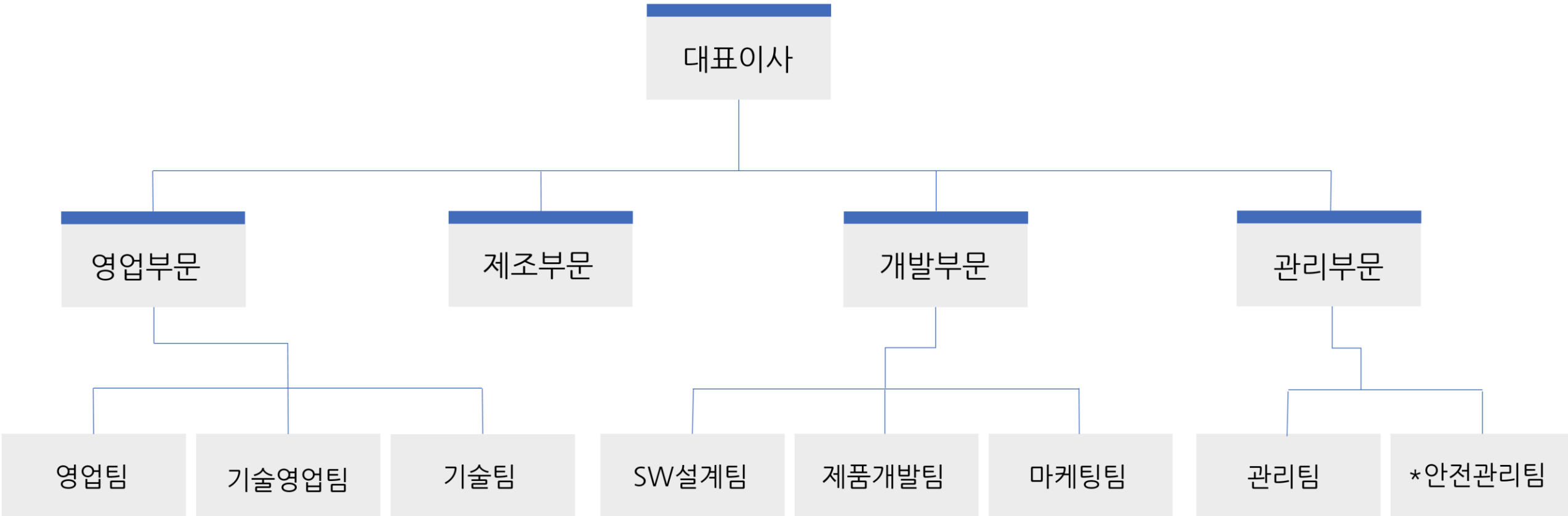
오츠카그룹 매출액
12.9조 원(2018)



사업분야

광학계측기기 개발,
제조, 수입 및 판매
산업자동화기기,
생체재료분석기, 신소재용 재
료분석기 등

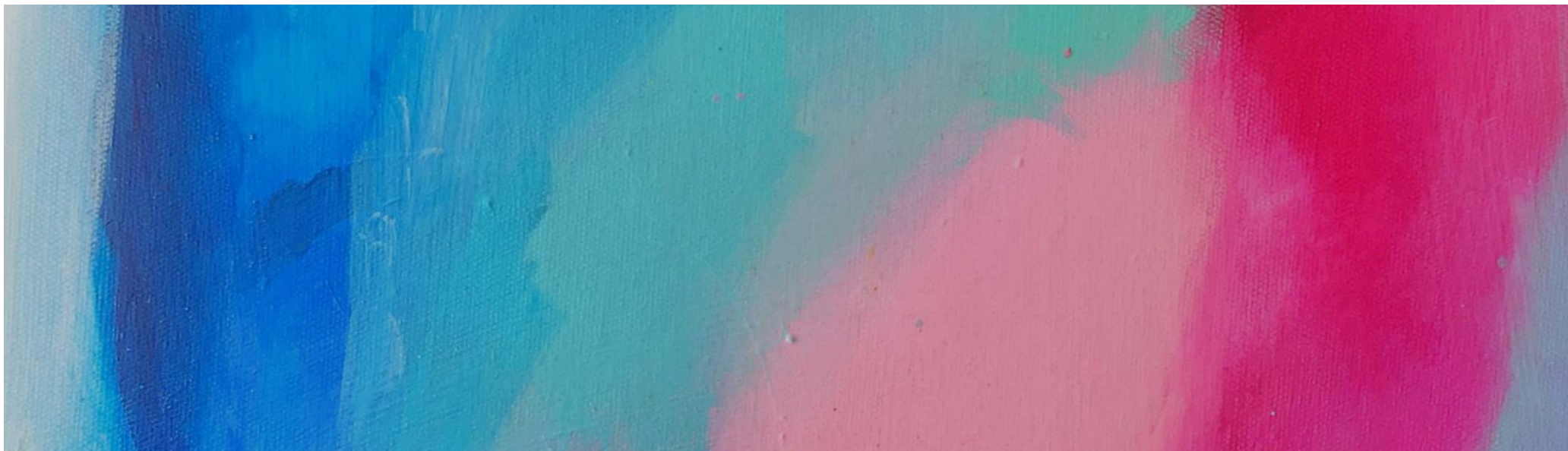
조직도



*Quality Assurance



Otsuka Otsuka Electronics Korea Co., Ltd.



제 품 소 개

제품라인



디스플레이 평가



Imaging photometer

HS-1000H

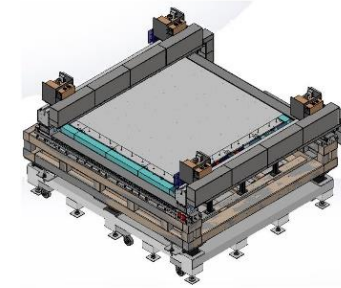
- 휘도균일성 평가
- 고속 측정 (프레임 당 1.5 초)
- 타제품 대비 300% 측정 시간 단축
- 대형 디스플레이 측정 가능



Color filter spectral inspection system

LCF

- FPD 공정에서 테스트 지원
- 완전 자동화 테스트
- CF 색도, BM OD 측정
- CF, OC, CS 두께 측정



Sheet resistance

RS

- 접촉/비접촉 RS 측정
- 저저항/고저항 측정
- 전도성 물질 및 필름 평가
- $CV < 1.5\%$ 의 재현성

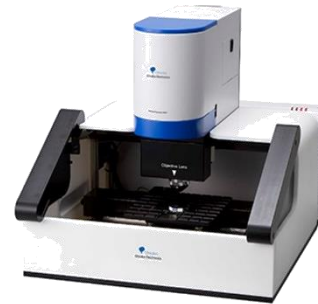
반도체 평가



Si wafer thickness monitoring system

SF-3 series

- 실시간 측정
- Si 웨이퍼 두께 평가
- CMP, backside grinding
- 비접촉/비파괴 측정



Microspectrophotometer

OPTM(UV SR) series

- UV부터 NIR까지의 파장범위
- 비접촉/비파괴 측정
- 고속 측정 (1초 미만)
- Automatic mapping



Spectro ellipsometer

FE-5000 series

- 엘립소메트리 평가
- UV부터 가시광선까지의 파장범위
- 자동 각도 조절 메커니즘
- Automatic mapping
- 초박막필름의 두께, 광학상수(n , k) 측정

필름 평가



Array spectrometer

MCPD series

- UV부터 NIR까지의 파장범위
- 가볍고 컴팩트한 디자인
- 넓은 노광 시간 범위
- 미광 보정 기능



Retardation film & material evaluation system

RETS 100

- 광학 필름 특성 평가
- 각 층의 위상차, 축 측정
- 다층 필름 평가 가능
- 비파괴 측정



LCD cell gap measurement

RETS series

- 편광 광학 시스템
- LCD 셀갭 평가
- 빈셀갭 평가
- 소형/대형 사이즈 모두 호환



High speed retardation measurement

RE-200

- 고정밀
- 고속 측정 (1초 미만)
- 단순한 설정으로 쉬운 측정 가능
- 0nm부터 낮은 위상차 측정

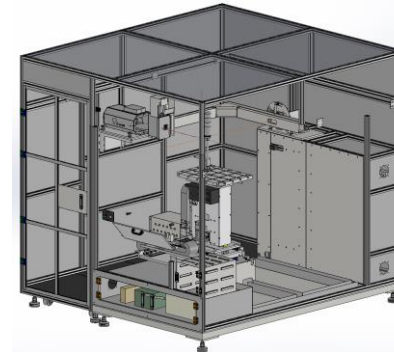
자동차 광원 평가



Headlamp aimer

HLA

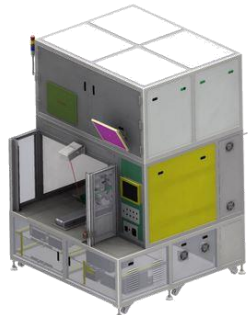
- 완성차 생산 공장
- 모든 종류의 광원 평가 가능
- 최종 검사 공정/품질 검사 단계
- 빠르고 반복적인 에이밍
- Floor / gantry / 포터블 타입



Goniophotometric tester

RH600(near field)

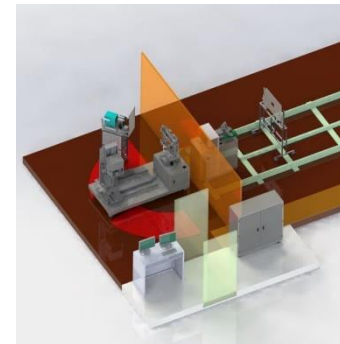
- LiDAR 광특성 평가
- 한 번의 측정으로 다양한 조건에서의 결과값 시뮬레이션
- 별도의 암실 설치 불필요



Headlamp aiming photometric tester

HLT600

- 헤드램프 제조 라인
- 모든 종류의 광원 평가 가능
- CAN / LIN 인터페이스 선택 가능
- 맞춤 제작 가능



Camera monitor system module tester

CMS

- 완전 자동화 시스템
- 테스트 적합/부적합 평가
- 반사경 대신 카메라와 모니터 사용

광원 평가



Luminous intensity measurement system

AL-1000

- 마이크로 LED 밝기 평가
- 고감도 분광기 탑재
- $1\mu\text{cd}$ 수준의 초 저휘도 정밀 측정



High sensitive spectroradiometer

HS-1000

- 고속 측정 (연속모드 시 20msec.)
- 넓은 휘도 범위
- 1% 미만으로 편광오류 최소화



High speed near field goniophotometer

RH series

- 배광 특성 평가
- 한 번의 측정으로 다양한 조건에서의 결과값 시뮬레이션
- 별도의 암실 설치 불필요
- 샘플을 고정시켜 정확한 측정 가능



Total luminous flux measurement system

HM/FM series

- 넓은 다이내믹 레인지
- 자기 흡수 보정 기능
- 기본 적분구 대비 2배 이상의 감도
- 샘플 자체의 음영 최소화

물성 분석



Multi-sample nanoparticle size measurement system

nanoSAQLA

- 한 번에 최대 5개의 샘플 측정 가능
- 고속 측정 (1회 측정시 1분 소요)
- 온도 구배 기능
- 가볍고 컴팩트한 디자인
- 오토샘플러 사용시 최대 50개 샘플 연속측정 가능



Particle size, zeta potential, molecular weight analyzer

ELSZ-2000 series

- 고체 샘플의 제타 전위 측정 가능
- 농축/희석 샘플, 유색/무채색 샘플 측정 가능
- 온도 구배 기능
- 용점 및 상 전이점 분석



Quantum efficiency measurement system

QE-2000 series

- 분말, 용액, 고체 등 다양한 샘플 측정 가능
- 낮은 미광
- 재여기제거기능으로 정확한 결과
- 손쉬운 셀 장착/탈착 가능



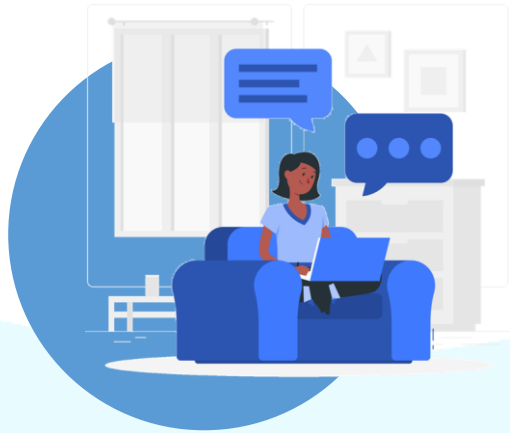
High sensitivity NIR quantum efficiency measurement system

QE-5000

- 일중항산소 측정
- 0.01% 이하의 양자 효율 측정
- 분말, 용액, 고체 등 다양한 샘플 측정 가능
- 액체질소가 없는 냉각 검출기 사용

Our products are limitless

Make innovation with us.



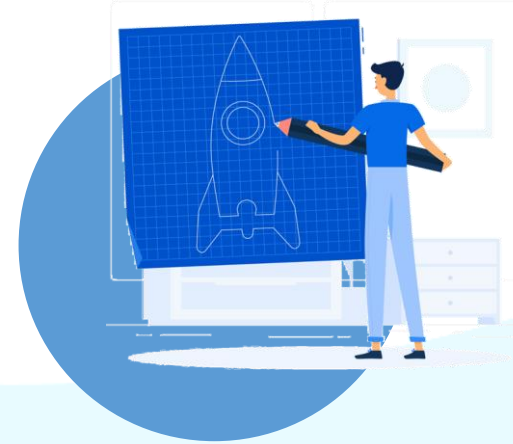
1. 문의

머리속으로만 그리고있는 이상적인
제품이 있으신가요?
고민하지 말고 연락하세요!



2. 설계

오랜 시간 축적해 온 광학 기술 지식과
경험을 바탕으로 원하는 사양을 갖춘
혁신적인 제품을 고안합니다.



3. 생산

설계가 완료되면 오츠카전자의
기술전문가들이 제품을 만들기
시작합니다.

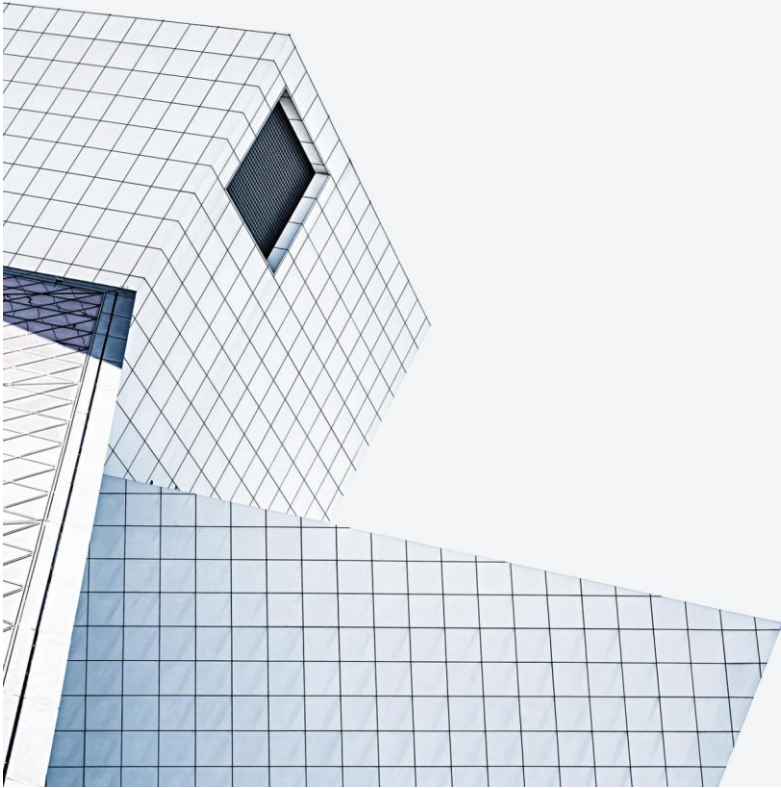


4. 완성!

당신이 원하던 바로 그 제품이
완성되었습니다. 제품은 배송지
까지 안전하게 전달됩니다.

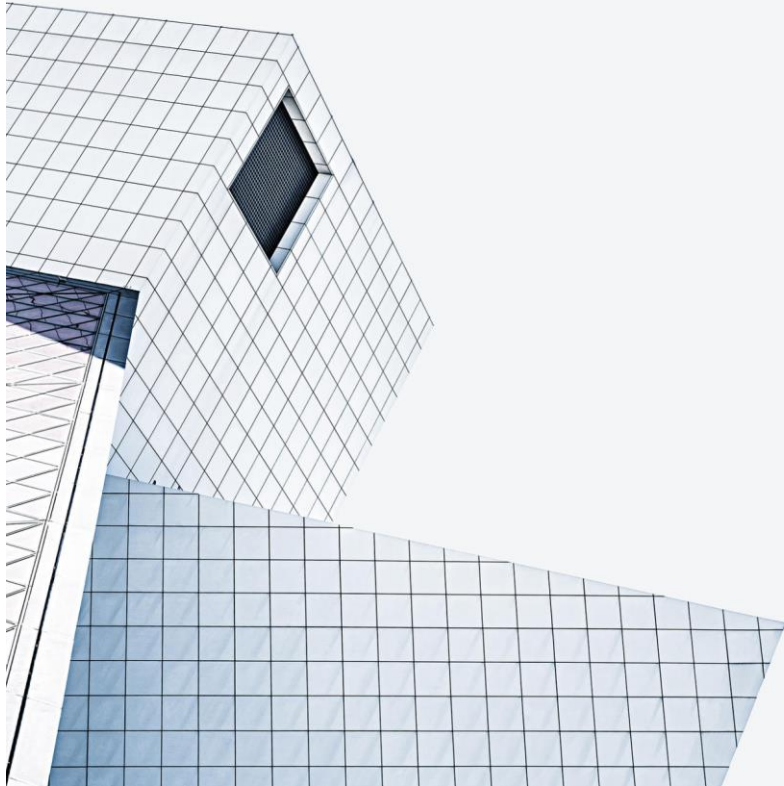
주요고객사

> COMPANIES



주요고객사

> LABS & UNIV.





THANK YOU



Otsuka Otsuka Electronics Korea Co., Ltd.

CONTACT

한국오츠카전자주식회사
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41 파인벤처빌딩 6층 B호
T. +82.31.766.8411
E. inquiry@otsukael.co.kr

ver. 1.1.1